U.D.C. 621. 385. 832

受像管の解像度について小泉 喜八郎*

The Resolution of the Television Picture Tubes

By Kihachirō Koizumi Mobara Works, Hitachi, Ltd.

Abstract

With the intention of determining effectively the resolution of TV picture tubes, the writer conducted first the comparative research on several measuring methods including microscopic mothod, double pulse method, shrinking raster method and Polka-dot raster method. Among these the last two have been admitted in general to have overall merits over the others, hence the writer finally tried elaborate comparison between these two methods, which ended to reveal the following facts:

- (1) No appreciable difference is observed between the two so far as the resolution is concerned.
- (2) The dot raster method is superior to the shrinking raster method when

viewed in terms of set adjustment.

Giving preference to the dot raster method on this account, the writer measured the resolution of 12 LP 4–A at the center and fringe part by this method, and found that there existed such a relation between No. 1 grid modulation Ed and the center resolution Vd as to be expressed by $V/a \propto 1/E^{3/4}$. The writer also measured deflectional distortion and established that the distortion in the tube fringe was proportionate to the square of diverging angle.

〔I〕緒 言

ブラウン管の解像度の測定には

(1) 顕 微 鏡 法 (Microscopic Method)

(2) ダブル・パルス法 (Double-pulse Method)

(3) ラスター圧縮法

(Shrinking-raster Method)

(4) ポルカ・ドット・ラスター法

(Polka-dot-raster Method)

(5) その他の方法

など,種々な方法が用いられているが,その使用法や測定すべき受像管の管種に応じ,それぞれ長所や短所がある。しかしながら,この内比較的広く採用されているのは(3)のラスター圧縮法⁽¹⁾である。受像管の解像度の測定としてはこの外にモノスコープを用いる方法もあるが,これは装置が相当高価であることおよび増幅器の特

* 日立製作所茂原工場

h,

性など回路的にも高度な技術を必要とするので,国内で は余り使用されていないようである。一方受像管の色々 の特性を測定するためには,このような高度な装置を使 用しなくても一応測定はできるし,かつ(3)や(4)の方 法によれば,実際に近い結果が得られることが期待され る。

一般にラスター圧縮法を受像管のような電磁偏向方式 のものに使用する場合には,垂直用コイルと水平用コイ ルのインピーダンスが異なるため,静電偏向方式の場合 のように垂直軸と水平軸とを単に切換えるのみでラスタ ーを 90 度回転する場合と違つて困難さがあるため,こ のような場合にはコイル自体を 90 度まわす必要がある。 したがつて,非点収差の有無や,調整の良否を検査する ために輝点のようすやラスターのようすを一度で知ろう とするには電磁偏向方式ではむずかしい。これらの点を 考慮すると,(4)のポルカ・ドット・ラスター法の方がよ いように思われる。たゞしこの場合に,ビーム電流の測

---- 83 -----

1276 昭和29年8月 日 T.

評 論

定が困難となるうらみはある。筆者はこれ等の不備を補 うため、(3)および(4)の方法を1つにおさめた装置を 試作し,受像管の特性に関して二,三の測定をする機会 を得たので、ここに報告する。

〔Ⅱ〕実験装置の概要

本実験に用いた装置は第1図に示すようなブロックダ イヤグラムの系統によつた。ラスター発生装置には200 kc 微分波パルス発生装置を附加して,ドットパターンを 出し得るようにした。

つぎにこれら装置の概要を述べよう。

(1) カウンター装置

これは主発振器の発振周波数に同期した 200kc, 5kc, 0.05 kc の信号パルスを得るための装置で、ほとんどが ブロッキング発振器により構成されている。

(2) ドットパルス発生装置

これはカウンター No.1 と No.2 の中間から 200 kc のパルスをとり出し、これをさらに増幅して微分回路に 入れて, 急峻なパルスにし, 陰極に与えるごとくしたも ので,最終段出力管の出力制御および受像管のグリウド 回路の制御により、ドットパターンとラスターパターン とを切換えることが出来る。

(4) 垂直偏向装置

カウンター No. 6 からのパルスを用いて, 0.05kc に 同期した鋸歯状波電流を垂直偏向コイルに供給するよう にしたもので,その振幅調整は出力管の入力信号電圧を 加減することにより 0~200mm くらいまで変えること ができる。しかしその直線性の補正には同回路中のピー キング抵抗および出力管のバイアス抵抗の加減により行 われる。

(5) 電源回路

受像管に供給すべき高圧電源は商用周波数から逓昇し た整流回路を用いた。こゝに注意すべきことはこの逓昇 に用いるトランスの漏洩磁界で,特に筆者が用いたよう な電源非同期のものでは、これによる防害が大きかつた ので、これらのトランス類をセットより遠ざけた。受像 管の第2格子 G2 の電圧は陰極に対し 50~300V まで 変化し得る。

[III] 解像度の測定法

(1) 垂直方向の解像度測定

この装置を用いて垂直方向の解像度を測定するには, 第2図(a)および(b)のごとくラスターあるいはドット

(3) 水平偏向装置

これはカウンター No. 3 から取出した 5kc のパル スを用いて,これに同期した鋸歯状波電流を水平偏向コ イルに供給するもので,ほとんど普通のテレビジョン受 像機の水平偏向回路と同様である。



受像管解像度測定装置の系統図 第1図

Fig.1. Schematic Diagram of the Resolution Test Set for the Television Picture Tubes

パターンを受像面に出し、これを第3図(a)および(b) のごとく垂直方向にパターンを圧縮してゆくとラスター の各線またはドットが見分けられなくなる。このときの 高さをhとするとこのhをラスターの数または垂直方向 のドットの数 m で割つた値 d が、 ラスターの輝線幅ま たはドットの大さを与えることになる。

すなわちはは

d=h/m(1) 一般にテレビジョン工学では受像管の解像度の目安と してパターン内に含まれ得る線数で表わしているが、こ れの線数とdとの関係を示せば,受像面の高さVをdで 割ればよい。すなちち受像管の解像度をRで表わせば

R = V/d

となる。

(2) 水平方向の輝点幅測定

水平方向の解像度を測定するには、偏向コイルを90度 回転して [II] 項 (2) の方法により行えばよいわけであ る。

ドット法においては, 垂直方向の長さをそのまへにし て,水平方向のみを圧縮すればよいわけであるが,水平 方向の圧縮は垂直方向の圧縮と異なり、周波数が高いた め,その直線性の保持が困難である。したがつてこれに ついては目下検討中であるので,今回はその輝点をScale を用いて測定した結果について述べよう。



---- 84 -----



第3図 第2図のドットおよびラスターパターンを圧縮した例

Fig. 3. Example of Shrunk Dot and Raster Pattern



X

〔IV〕実験およびその結果

実験に用いた受像管は日立 12 LP 4-A で,その主要 寸法は第4 図に示すごときものである。

(1) ドット法とラスター法との比較

まず始めはドット法とラスター法とで、その解像度の 値がどのように違うかを検討した。実験条件は加速電圧 10kV,第2格子電圧250Vとし、第1格子のバイアス 電圧を変え、両法の解像度を測定した(解像度として輝 線幅または輝点幅をとつた)。第5図の上の曲線はラス





Fig.5. Comparison of Resolutions Measured by Raster and Dot Method

- 85 ----



て丁度パターンの消える点をとつてある。

この両者を比較すると、グリッド変調電圧が同じなら その解像度はほぼ同じである。また筆者が用いた装置で



はドット法における平均電流 \overline{I}_e はラスター法の電流 I_e の約 1/15 である。この結果からみると、ラスター法で一度放射電流対グリッド電圧との関係を求めておけばドット法でも放射電流対解像度との関係を検べることが可能である。

つぎに電子銃と集束コイとの中心合せが悪い場合につ きこの両法を比較すると,第6図(a)および(b)のよう にラスターでは一様に輝線が細い場合でも,これをドッ トにすると,非点収差がはつきり認められる。したがつ てラスター法のみでは余程注意しないと,解像度の測定 に大きな誤を生ずる恐れがある。

(2) 垂直方向の解像度測定

[IV] 項(1) で述べたごとくラスター法に比しドット 法の方が誤りが少いので,以下の実験はドット法で行わ れた。

垂直方向の解像度として、中央部とこれから左右それ ぞれ 100 mm 離れた点について測定した。この結果を示 すと、第7 図のごとくである。この図では第2 格子電圧 E_{g^2} を変えて、平均放射電流 \overline{I}_e が一定となるように第 1 格子電圧 E_{g^1} を調整した場合における解像度を示すも ので、 E_{g^2} が増すにつれ、中央部の解像度はよくなるが、 周辺部の解像度は悪くなる。この理由を知るため、同じ 条件において集束および偏向をやめた場合の螢光面の輝 点の大さを測定すると、第8 図に示すごとく、 E_{g^2} の増 加につれて、この輝点もまた増してくる。このため中央

- 第7図 第2格子電圧による輝点の変化 A: 中央部の解像度
 - B: 中心部より 100mm はなれた周辺部 の解像度
- Fig.7. Variation of Spots According to the Value of No. 2 Grid Voltage



- 第8図 第2格子電圧による輝円の大さの変化 (発散角に関係するもの)
- Fig.8. Variation of No Focusing Spot According to the Value of No. 2 Grid Voltage

- 86 -----

部より周辺部が急速に偏向歪により解像度が悪くなるこ とが知られる。

(3) 水平方向の輝点幅の測定

ドットパターンとして,210mm×160mmのパターン を出し,その中央軸に沿つて,水平方向の輝点幅を測定 した結果の一例をあげると第9図のごとくである。実験 条件は附記したごとくである。

[V] 結果に対する検討

つぎに [IV] で測定した結果について,二,三の検討 を行つてみよう。

(1) 第1格子変調電圧と解像度

この関係は第5図に示したごとくであつて、このよう にドット法では中央部の輝点幅 d と変調電圧 E_d との関 係を求めると、第10図のごとく、

となる。近似的にはdは Ed に比例すると考えても大過 い。なしたがつて、本数で表わした受像管の解像度は第 1格子の変調電圧にほぼ逆比例して悪くなる。

(2) 同一螢光面輝度とした場合の





第9図水平軸方向の輝点の大さ 第2格子電圧=250V

Fig.9. Variation of Spot Along the Horizontal Axis



第2格子電圧の影響

螢光面の輝度は陽極電流の小なる間はほぼこれに比例 するから, 陽極電流が等しければ螢光面輝度もまた等し いと考えてよい。陽極電流を一定として,第2格子電圧 Eg2 を変えると,第8図に示したごとく集束レンズに入 る電子ビームの径はこれに伴つて増減する。したがつて このビームを偏向すれば, 偏向歪のため像周辺の解像度 はビームの径に応じて変化するから,第2格子電圧 E_{g2} により周辺の解像度に影響があることが知られる。今, 垂直方向の偏向歪 D_V を

 $D_V = d_l - d_{l=0} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (4)$

 $\begin{pmatrix} d_{l} & l \end{pmatrix}$ は中央から $l \\ t \\ l \\ t \\ t \end{pmatrix}$ なる点の輝点の大きさ したがつて $d_{l=0} & l \\ t \\ l \\ t \end{pmatrix}$ にのときを示す。 で表わすと、筆者の実験では、Dvと集束および偏向を 行わない場合の螢光面の輝円Dとの間には

の関係が成立つ(第11図参照)。このDと集東レンズへの ビームの入射角 a との間には比例関係があるから,

の関係が得られる。

偏向歪を考慮すると, 第2格子電圧を余り大きくしな い方がよいが、しかし余り第2格子電圧を下げると、中 央部の解像度が悪くなるほか,第1格子のカットオフ電 圧も小さくなつて、コントラストを下げる結果になるの で、注意を要する。





Fig.11. Relation of No Focusing Spot to Vertical Deflectinal Distortion

---- 87 -----

日 立 評 論

第36巻第8号

(3) 水平方向の偏向歪について

水平方向の輝点幅を測定した結果は第9図のごとく偏 向歪があるが、今この偏向歪 D_h を

 $D_h = \delta_l - \delta_{l=0} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (7)$ $\begin{pmatrix} \delta_{l} & i + i + i \\ l & i \\ l &$ で表わすと, 筆者の実験では

 $D_h = k l^{1.8} = k' i^2 \dots (8)$ となる(第12図参照)。

一般に受像管では偏向コイルによる偏向歪のため,周 辺の解像度は垂直および水平方向ともに外周にゆくにし たがつて低下する。したがつて,理想的な受像管では, クロスオーバーが小さくその上, 集束レンズへの入射角 が小さいことが望ましい。このような理由から最近は第 2格子と加速電極との間にさらに第3格子に挿入した受 像管も出現しているようである。

[VI] 結 言

ラスターおよびドット法を用いて受像管の解像度に関 して測定したが,両者ともほぼ同じような測定精度であ つた。しかしそのほかの点ではドット法の方がすぐれて いる。ドット法を用いて 12 LP 4-A の解像度に影響す べき要素を2,3 測定したが、特に周辺の解像度に大き な影響をおよぼすものとして偏向コイルによる偏向歪が ある。



第12図 水平距離と水平方向の偏向歪との関係

Fig.12. Relation of Horizontal Distance to Horizontal Deflectional Distortion

室の各位に厚く感謝申上げる。また、本研究を発表する 機会を与えられた日立製作所茂原工場橋本博士に厚くお 礼申上げる。

本研究は筆者が日立製作所中央研究所において, 只野 博士御指導の下に行つたもので, 只野博士および同研究

考文献 参

Soller, Starr and Valley: "Cathode Ray (1)Tube Displays" pp. 590~608 McGrad-Hill (1948)



「日立」綴込カバー 1冊 ¥220 (郵送料共) 特価 愛読者各位の多年の御要望でありました「日立」 綴込カバーが完成致しまして、すでに発売致してお ります。 表紙は燕脂色の堅牢優美な総レザーで12冊(1箇 年分)を金具で綴込むようになつております。 御申込は東京振替口座71824番日立評論社宛御申 込下さい。

評論社電話(27) 0111(10), 0211(10), 0311(10) 千代田(27) 1111(10), 1211(10), 1311(10) 東京都千代田区丸1内1丁目4番地 B $\overline{\mathbf{v}}$ (新丸ビル7階)

---- 88 -----